

SEMセミナー

近年、各種材料の微細化や多機能構造を有する材料がめまぐるしく発展し、この各種材料の評価がクローズアップされてきております。この各種材料の表面や断面の評価手法として、おおきな威力を発揮するのが走査電子顕微鏡です。従来CCD デジタルスコープで観察を行っていた数千倍程度の観察を、焦点深度が深く、前処理なしで行える卓上低真空走査電子顕微鏡で行うことが着目され、大きな成果を挙げております。

当施設では最新卓上SEM**TM4000Plus II**を導入いたしました。つきましては、メーカーから講師をお招きし、**最新のアプリケーション事例**をご紹介しますセミナーを開催させていただきます。

皆様のご参加をお待ちしております。

参加無料

日 時 2022年6月3日（金）13:30～15:30

講 演

電子顕微鏡 観察・分析における卓上低真空SEMの拡がる可能性
～日立TM4000PlusIIの最新アプリケーション事例のご紹介～

講演時間 13:30～15:00（講演後質疑）

講 師 （株）日立ハイテク 上村 健氏

場 所
定 員

WEBセミナー（オンライン・ライブ）形式

200名 ※原則として先着順とさせていただきます。

申込方法

Google Formにてお申し込みください。

申込み用Google Formsのアドレスは機器分析施設の
ホームページにてご確認ください。

申込締切

5月31日（火）



問合せ先

富山大学 研究推進機構 研究推進総合支援センター
自然科学研究支援ユニット 機器分析施設
内線（6825） Tel：（076）445-6825
E-mail： yono@ctg.u-toyama.ac.jp



マスコットキャラクター
ぶんせきっず